

ENERJİ DAĞILIMLI X-IŞINLARI FLORESANS SPEKTROMETRESİ (EDXRF) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz tamamen bilgisayar kontrollü olmalıdır.
2. Katı, sıvı, toz ve ince film gibi farklı türdeki örneklerin analizine olanak sağlamalıdır.
3. Analizler düşük ppm seviyesinden yüksek % seviyelerine kadar geniş bir konsantrasyon aralığında gerçekleştirilebilmelidir.
4. Maksimum 50 W güçte ve 50 kV Pd anotlu X-Işını tüpüne sahip olmalıdır.
5. Cihazın yığın (bulk) örneklerin analizine uygun örnek haznesi olmalı ve otomatik pozisyonlamaya imkan tanımalıdır.
6. Cihaz döner özellikli otomatik örnek değiştirici özellikli örnek haznesine sahip olmalıdır.
7. Cihaz Na (11) ve U (92) aralığındaki tüm elementlerin nicel ve nitel analizlerini yapabilmelidir.
8. Dedektör tipi yüksek çözünürlüklü SDD (Silicon Drift Detector) olmalıdır.
9. Cihaz, hava ve helyum atmosferinde çalışabilmelidir.
10. Cihaz yazılımı, analiz için seçilen elementlere bağlı olarak uygun sekonder hedefi otomatik olarak belirleyebilmelidir.
11. Cihaz yazılımı; temel parametre ve kalibrasyon tabanlı analiz modlarını desteklemelidir.
12. Cihaz yazılımı, standartsız analiz desteğine sahip olmalıdır.
13. Cihaz yazılımı, spektrum verilerini csv formatında dışa aktarabilmelidir.
14. Analiz sonuçları ppm, % mass, ppb, ppt ve mg/kg olarak farklı birimlerde verilebilmelidir.
15. Cihaz ile uyumlu markalı ve güncel bir bilgisayar ve yazıcı mevcut olmalıdır.
16. Cihaz, çalışma esnasında kapağının açılmasına izin vermeyecek şekilde bir kilit sistemine sahip olmalıdır.